

25-27 вересня 2019 рокуВиставковий центр ACCO International
Україна, м. Київ, проспект Перемоги, 40-Б**УВАГА! НОВЕ МІСЦЕ
ПРОВЕДЕННЯ ВИСТАВКИ****МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА КОМПЛЕКСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛАБОРАТОРІЙ**

X Науково-практична конференція НАН України
«Новітні розробки наукового обладнання провідних приладобудівних компаній.
Розвиток центрів колективного користування в НАН України»

Дата та час проведення:	27 вересня 2019, 10.00–16.00
Місце проведення:	м. Київ, Виставковий центр ACCO International, пр-т Перемоги, 40-Б, зал № 1
Організатор:	НАН України
Організаційний комітет:	<i>Сторіжко В.Ю.</i> , ак. НАН України, голова конференції, голова Міжвідомчої ради з наукового приладобудування при Президії НАН України; <i>Кубальський О.Н.</i> , к.філос.н., заст. голови, перший заступник головного вченого секретаря НАН України; <i>Котенко В.А.</i> , к.ф.-м.н., заступник начальника Науково-організаційного відділу Президії НАН України; <i>Жирко Ю.І.</i> , к.ф.-м.н., секретар Комісії з питань модернізації парку наукових приладів та обладнання НАН України; <i>Колтун О.Я.</i> , к.т.н., директор Експозиційного центру «Наука» НАН України; <i>Костецький В.І.</i> , к.т.н., секретар конференції

ПРОГРАМА*

10.00-10.05	Вступна промова на відкритті науково-практичної конференції <i>Сторіжко В.Ю.</i> , голова конференції, акад. НАН України
10.05-10.30	Система вимірювання трибологічних характеристик надтонких плівок <i>Марченко О.А.</i> , чл.-кор. НАН України, зав. відділу Інституту фізики НАН України
10.30-10.50	Вакуумний пост для отримання покриттів методом магнетронного розпилення <i>Коломієць В.М.</i> , к.ф.-м.н., с.н.с., НДЦ науково-навчальних приладів Інституту прикладної фізики НАН України
10.50-11.10	Автоматизований прилад для визначення залишкових напружень в конструкційних матеріалах методом електронної спекл-інтерферометрії <i>Савицький В.В.</i> , к.т.н., с.н.с. Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України
11.10-12.00	ПЕРЕРВА
12.00-12.20	Системи пробопідготовки зразків до ЕМ та оптична мікроскопія від Leica Microsystems представник компанії АЛТ Україна Лтд
12.20-12.40	Сучасні інструментальні методи елементного аналізу від Analytik Jena AG представник компанії АЛТ Україна Лтд
12.40-13.00	Застосування обладнання компанії TA Instruments в науково-дослідних лабораторіях представник компанії INTERTECH Corporation
13.00-13.20	Новітні розробки аналітичного обладнання корпорації SHIMADZU представник компанії ШімЮкрейн
13.20-13.40	Методи ІЧ-візуалізації та спектроскопії поверхні в наномаштабі представник компанії OPTEC LLC
13.40-14.10	ПЕРЕРВА
14.10-15.30	Круглий стіл – Щодо розвитку центрів колективного користування в НАН України за участю вчених України, представників фірм-виробників, Організаційного комітету конференції